http://www.jgjs.net.cn

第38卷 第4期	激	光	技	术	Vol. 38, No. 4
2014 年 7 月	LASE	R TEC	HNOLO	GY	July,2014

文章编号: 1001-3806(2014)04-0445-04

弱电导材料中载流子迁移率的测量方法研究

刘强虎1,张紫浩1,刘志春2,张晓光1

(1. 光电信息控制和安全技术重点实验室, 三河 065201; 2. 第二炮兵驻锦州地区专用保障装备军事代表室, 锦州 121000)

摘要:为了精确测定弱电导材料中载流子迁移率,采用渡越时间方法测量了 8-羟基喹啉配合物(Alq₃)的载流 子迁移率,对渡越时间方法需要的实验条件进行了理论分析和实验验证,讨论了激发光源的波长、单脉冲能量以及 测量电路的积分时间常数的选取对材料载流子迁移率测量结果的影响。结果表明,采用渡越时间方法测量弱电导 半导体材料中载流子迁移率时,只有严格选取合适的测量条件,才可能获得准确、可靠的测试结果。此结论有助于 对有机电致发光器件载流子迁移率进行精确测定。

关键词:光电子学;渡越时间法;载流子;迁移率;弱电导 中图分类号:074 文献标志码:A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.04.003

Study on measurement method of carrier mobility in weak photoconductive material

LIU Qianghu¹, ZHANG Zihao¹, LIU Zhichun², ZHANG Xiaoguang¹

(1. Laboratory of Electro-Optical Information Control and Security Technology, Sanhe 065201, China; 2. Specific Support Equipment Military Representative Office of Second Artillery Stationed in Jinzhou Region, Jinzhou 121000, China)

Abstract: In order to measure the carrier mobility of weak conductive material accurately, the charge carrier mobility of Alq_3 was measured with the method of time of flight (TOF). The experimental conditions of TOF were analyzed theoretically and verified experimentally. The effects of the wavelength of the excitation light source, the single pulse energy and the selection of integration time constant of circuit measurement on the material carrier mobility measurement results were discussed. The results show that TOF is a typical optical measurement method. But it is possible to obtain accurate and reliable test results when measuring the carrier mobility of weak conductive material by means of TOF only if selecting appropriate measurement conditions strictly. This conclusion is helpful for the accurate measurement of carrier mobility of organic electroluminescent device.

Key words: optoelectronics; time of flight method; charge carrier; mobility; weak photoconductor

引 言

目前,有机小分子材料、金属配合物和高分子导 电聚合物材料被广泛应用于电致变色、变温和电致 发光器件中^[1],有机薄膜器件基于有机薄膜电致发 光、电致变色的原理,借助化学功能材料将电能直接 转化为光能、化学能,具有体积小、功耗低、易加工、

E-mail:solarboy1980@163.com

易掺杂、颜色变化丰富的特点,并且可制作在软基片 上,器件可弯曲和折叠(柔性),极大地满足了频谱 特性及发射率调控要求,扩展了工程应用价值。

有机电致发光、变色器件目前多采用多层结构^[2],为了提高效率,必须使载流子平衡注入发光 层或变色层,这就要求详细了解材料中电子/空穴输 运的动力学特性,并对载流子迁移率进行精确测定, 以便于器件设计。而有机和聚合物材料都属于弱电 导材料,传统的以电磁为主测量手段已经不适合,目 前国内外研究者推崇的渡越时间(time of flight, TOF)法在计算的过程中最重要的是对渡越时间的 精确测量^[3]。本文中介绍了 TOF 方法的原理,测量 了 8-羟基喹啉配合物(Alq₃)的载流子迁移率,讨论

基金项目:光电信息控制和安全技术重点实验室基金 资助项目(9140C150307120C1501)

作者简介:刘强虎(1980-),男,硕士,工程师,研究方向 为激光与物质相互作用。

收稿日期:2013-07-29;收到修改稿日期:2013-09-28

了激发光源的波长、单脉冲能量以及测量电路的积 分时间常数的选取对材料载流子迁移率测量结果的 影响。

1 实 验

1.1 测试样品制备

用 TOF 方法测量材料的载流子迁移率,首先要制备该材料的测试样品。测试样品的制作过程分4 个步骤,如图1所示。



Fig. 1 Flowchart of test sample preparation

在真空蒸镀之前用铜片分别设计氧化铟锡(indium-tin oxide,ITO)层、有机层和金属层的模板,用 质量分数为0.38的HCl溶液+Zn粉配成的溶液对 ITO导电膜玻璃刻蚀后,用铜片制成的蒸镀有机膜 的掩膜板蒸镀有机小分子材料和背电极。

实验中发现待测样品膜层的表面形貌受蒸发速率的影响,所以要控制蒸镀速率在0.1nm/s到0.3nm/s之间,以保证优良的膜层质量,蒸镀的测试样品的厚度从几百纳米到几个微米。金属电极的蒸镀与前面有机膜的蒸镀相类似。由于迁移率的测量对金属电极的表面形貌无过高要求,因此可以适当提高金属电极的蒸镀速率,一般金属电极(铝)的厚度在200nm到300nm左右。

1.2 渡越时间方法

实验时,为了提高被测样品内的光生载流子的 量子产率,要选取波长处在有机材料的吸收区内的 激发光源。对于 Alq₃来说,其吸收光谱如图 2 所 示。

由图可见,该材料对波长在 450nm 以上的光基 本上不吸收,在 350nm 和 410nm 波长之间有较大的 吸收,所以选择中心波长 800nm 倍频后 400nm 的飞 秒激光作为光源,然后用能量衰减片加扩束透镜的方 法,把最后照射在 ITO 玻璃工作区域上的能量控制在 微焦量级,尽可能保证弱光注入,同时还可以随时变 化入射光脉冲能量的大小。探测仪器用数字存储示



波器和 boxcar 同时检测和采集数据,稳压电源为 0V~ 120V,取样电阻 R 为 Z × 21 型直流多值电阻箱。

实验布置图如3所示,ITO 接电源负极,Al 接电源正极,电极间加电压 V,于是样品中建立起稳定的电场 E₀,则:

$$_{0} = V/d \tag{1}$$





Fig. 3 Schematic of the experimental setup for TOF

此时,阴极和阳极上分别带有 – Q和 + Q的电 荷,样品电阻远大于取样电阻 R_{\circ} 当一个脉冲宽度小 于载流子渡越时间的外激励光脉冲辐照到取样样品 上时,光脉冲产生的载流子在外电场 E_0 作用下移动, 当时间为 t时到达 x 位置(取左电极处 x = 0)。此时 阴极上由于静电感应,其瞬时总电荷变为 – $Q + q_1$,阳 极上的瞬时总电荷变为 $Q + q_2$,因此使样品中原来 的电场发生了变化。由于外加电压未变,设电荷层 左边的电场强度变为 E_1 ,石部电场强度变为 E_2 ,因 而有:

$$E_1 \times x + E_2 \times (d - x) = E \times d \qquad (2)$$
式中, E 为外加电场。根据高斯定理有:

$$-S \cdot \varepsilon_0 \varepsilon_r E = -Q \tag{3}$$

$$-S \cdot \varepsilon_0 \varepsilon_r E_1 = -(Q - q_1) \tag{4}$$

$$S \cdot \varepsilon_0 \varepsilon_r E_2 = Q + q_2 \tag{5}$$

式中,*S* 是载流子层即两电极间工作区域的面积, ε_0 为真空介电常数, ε_r 为相对介电常数。由(1)式~ (5)式联合解得电极上的感应电荷和左右两部分的 第38卷 第4期

电场强度为:

$$\begin{cases} q_1 = Ne\left(1 - \frac{x}{d}\right) \\ q_2 = Ne\frac{x}{d} \end{cases}$$
(6)

$$\begin{cases} E_1 = E_0 - \frac{Ne}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} \left(1 - \frac{x}{d}\right) \\ E_2 = E_0 - \frac{Ne}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} \frac{x}{d} \end{cases}$$
(7)

式中,N为被激励出的总载流子数,e为电子电量。 电极板上的电荷会由于载流子层的运动而发生再分 布,当载流子层由0处运动到 x 处时,右电极上电荷 量的总变化为:

$$\Delta Q = \varepsilon_o \varepsilon_r S \Delta E_2 = \frac{Nex}{d} \tag{8}$$

因而电阻两端电压增量为:

$$\Delta V(t) = \frac{Ne}{Cd} x = \frac{Ne}{Cd} vt$$
(9)

式中,C为电容;v为载流子速率;t为时间。

当测量电路的积分时间常数 t_{RC}≪T_{TOF}(T_{TOF}为 渡越时间),则电荷在极板上的变化直接在取样电 阻 R 上产生电流脉冲:

$$i = \frac{Ne}{d}v \tag{10}$$

由电流脉冲宽度求得 *T*_{ror}后,就可以由样品厚度 *d* 和外加电场 *E* 求出漂移迁移率:

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{d^2}{T_{\rm TOF}V_s} \qquad (11)$$

式中, V_s 为测试样品两端电压。有机半导体属于非晶态类型,对载流子运动最主要的影响是深陷阱和 浅陷阱,它们会使载流子束缚多次,载流子在渡越过 程中会不断地损失,N 不再保持为常数,这称为弥散 输运^[4]。采用电流脉冲法测量渡越时间 T_{TOF} 时,要 求 $t_{RC} \ll T_{\text{TOF}}$,外电路的 RC响应时间越小,所测得的 载流子的渡越时间 T_{TOF} 就越准确。由此可见,TOF 的波形会受到外电路 RC 特性的影响。另外,要使 载流子产生的空间电荷场不能明显改变电极间的静 电场分布,光生载流子的数量就必须足够小,即 $q_0 \ll CV(q_0$ 为注入电荷,V为电压)。

2 数据处理及结果分析

2.1 Scher-Montroll 模型

Scher-Montroll 模型的原理就是用统计学的理论来研究弥散输运中载流子的迁移率问题^[5]。后

来广泛适用于描述聚合物体系和非晶体中的弥散输 运现象。当不存在弥散输运问题时,它的弛豫时间 和跳跃时间都遵循着一个指数分布,载流子在跳跃 点之间跳跃的移动速率是常数。而弥散输运中载流 子移动速率随机变化,所以 TOF 光电流信号会出现 一个长长的尾巴^[6]。SCHER 和 MONTROLL 采用弛 豫时间幂指数分布函数来描述这种无序的影响,其 分布函数为 $\Psi(t) \approx t^{-(1+\alpha)}$,其中,参量 α 表征无序 程度, $\alpha \in [0, \infty)$ 。由分布函数可见: α 的值越小, 弥散输运的程度就越高^[7]。Scher-Montroll 模型的一 个最重要假设是,瞬态光电流会遵循幂指数的形式 衰减:

$$i(t) = \begin{cases} t^{-(1-\alpha)}, (t < T_{\text{TOF}}) \\ t^{-(1+\alpha)}, (t > T_{\text{TOF}}) \end{cases}$$
(12)

式中,*T*_{ror}表示渡越时间,此即为幂指数定律^[8]。根据此式,采用对数坐标变换电流和时间坐标轴,就可以得到载流子的渡越时间。

2.2 影响载流子渡越时间测量的因素分析

由前面的分析可知,外电路的 RC 特性对载流 子渡越时间的测量影响很大。当取样电阻 R 较大 时,无法满足 RC 响应时间远远小于 T_{ror}的要求,从 而无法得到真实的渡越时间值;当取样电阻 R 足够 小时,此时信号微弱,信噪比很小,也无法得到精确 的渡越时间值。为了尽可能提高渡越时间测量精 度,用 boxcar 提高信噪比后,以 Alq₃ 为例,在室温、 样品中电场为4×10⁵V/cm 时,改变取样电阻值大 小,得到 TOF 信号如图4所示。







Fig. 5 Log-log plot of photocurrent change with different sampling resistance

time/us



Fig.6 Change of drifting time vs. sampling resistance 进行恢复,减小取样电阻阻值能保证实验条件和测 量精度。

同时,要满足光生载流子的数量必须足够小,首 先固定外取样电阻值和外加电压,通过能量衰减片 改变脉冲光单脉冲能量的大小,对 Alq₃ 进行一系列 测量,并用 Scher-Montroll 模型对所测得光电流曲线 进行处理得到载流子渡越时间,如图 7 所示。





从实验结果也能看出,TOF 方法测量的一个基本要求是光生载流子层要控制在非常薄的范围内,如果能量过大,则产生的载流子层过厚,将会导致样品的体激发,而非薄层激发,这样会影响测量的精度。在同一波长激光激励下的不同有机发光二极管

材料,其光生载流子率差别很大,反应到能量注入上 也会有很大的不同。因此,在实验中,为了尽可能保 证测量的精度,应该对光脉冲能量的大小做严格限 制,反映到渡越时间上,它的值也就越稳定,最后求 得在 293K、电场强度为4×10⁵V/cm 的条件下 Alq₃ 的电子迁移率μ=1.23×10⁶ cm²/(V・s)。

3 结 论

制备了 Alq₃ 的 TOF 测试样品器件,分析了渡越 时间法需要的实验条件,在实验中着重解决了以下 问题:(1)激发光源的影响。为了提高被测样品内 的光生载流子的量子产率,必须选取波长处在有机 材料的吸收区内的激发光源,并且严格控制激励光 为弱注入,避免样品内部产生空间积累电荷,影响样 品内部电场的均匀分布,从而影响测量结果。(2) 外电路的 RC 特性对载流子渡越时间的测量影响很 大。当取样电阻 R 较大时,无法满足 RC 响应时间 远远小于 T_{TOF}的要求,就无法得到真实的渡越时间 值;当取样电阻 R 足够小时,此时信号微弱,利用微 弱信号探测仪器把从信号从噪声中提取出来,提高 信噪比可以保证测量的精度,反映到渡越时间上,它 的值也就越稳定。

参考文献

- SCOTT J C, PAUTMEIER L T, SCHEIN L B. Mean mobilities of charge carriers in disordered media [J]. Physical Review, 1992, B46(13): 8603-8606.
- [2] TANG C W, VANSLYKE S A. Organic electroluminescent diodes
 [J]. Applied Physics Letters, 1987, 51(12): 913-915.
- [3] WEI ZH Q, YANG Q X, SUN G J, et al. Photoelectric method of carrier mobility measuring[J]. Journal of Optoelectronics · Laser, 2001,12(9):930-933(in Chinese).
- [4] JUSKA G, GENEVICIUS K, ARLAUSKAS K, *et al.* Charge transport at low electric fields in π -conjugated polymers[J]. Physical Review, 2002, B65(23):233208.
- [5] HUANG Ch H, LI F Y, HUANG Y Y. Optoelectronic materials ultrathin films [M]. Beijing: Peking University Press, 2001: 238-298 (in Chinese).
- [6] WU F, TIAN W J, ZHANG Z M, et al. Organic electroluminescent device based on balanced carriers injection and transportation
 [J]. Thin Solid Films, 2000, 363(1/2): 214-217.
- [7] BASSLER H. Hopping conduction in polymers [J]. International Journal of Modern Physics, 2003, 8(7): 847-854.
- [8] FORERO S, NGUYEN P H, BRÜTTING W, et al. Charge carrier transport in poly(p-phenylenevinylene) light-emitting devices[J].
 Physical Chemistry Chemical Physics, 1999(8): 1769-1776.